

Aplikace analytických metod pro:

Analýzu celkového složení (bulk analysis):

- **Jiskrová a oblouková OES**
- **LIBS**
- **Grimm OES**
- **Jiskrová a laserová ablace + ICP-OES (ICP-MS)**
- **RTG fluorescenční spektrometrie**
- **Jiskrová MS**
- **Grimm+MS (GD-MS)**
- **RTG spektrometrie**

Lokální mikroanalýzu:

- **RTG spektrometrie primárního záření**
- **Augerova elektronová spektrometrie**
- **LA-ICP-MS (OES)**
- **LAMMA, SIMS, SEM**

Analýzu povrchových vrstev (depth distribution analysis):

- **Grimm OES, MS**
- **Laserová ablace + ICP MS (ICP OES)**
- **Iontové odprašování + SIMS, RIMS, Auger, atomová fluorescence**
- **Rutherford backscattering spectrometry**

Analýzu povrchů (atomární vrstvy):

- **Fotoelektronová spektrometrie – ESCA**
- **Spektrometrie energetických ztrát elektronů**
- **Field ion microscopy**
- **STM (scanning tunneling microscopy)**
- **AFM (atomic force microscopy)**